

Programm / 29. Oktober 2008

Charakterisierung von metallischen Beschichtungen und Oberflächen

- 08.15 Uhr **Begrüssungskaffee / Anmeldung**
- 09.00 Uhr **Dr. Johann Mischler, EMPA Thun**
Mechanische Eigenschaften von Schichten (D)
- 09.30 Uhr **Philippe Kempe, CSM Instrument SA, Peseux**
Überblick über messbare Eigenschaften mittels Nanoeindringprüfung und Ritztestmethoden (F)
- 10.00 Uhr **Apéro und Ausstellungsbesichtigung**
- 10.30 Uhr **Prof. Cathy Meunier, Université Franche-Comté, Montbéliard, F**
Diamant-ähnliche Keramische Beschichtungen (F)
- 11.00 Uhr **Martin Bossard, SCHAEFER-TEC AG, Kirchberg**
Röntgenfluoreszenz/optische Profilometrie zur Charakterisierung metallischer Oberflächen (D)
- 11.30 Uhr **Dr. Mousad Hadad, EMPA, Thun**
Beurteilung der Haftfestigkeit von plasmabeschichteten WC-Co-Cr Multilagen (F)
- 12.00 Uhr **Mittagessen**
- 13.30 Uhr **Urs Fischer, Schweizerische Normen-Vereinigung, Winterthur**
Normung und laufende Projekte im Bereich Beschichtungen und Oberflächen (D)
- 14.00 Uhr **Markus Zraggen, EMPA Dübendorf**
Schäden im Zusammenhang mit dem Verzinken (D)
- 14.30 Uhr **Kaffeepause und Ausstellungsbesichtigung**
- 15.00 Uhr **Raphael Granges, ARIAQ SA, Yverdon**
Qualität - die Herausforderung für die Zukunft (F)
- 15.30 Uhr **Dr. Lukas Eschbach, RMS Foundation, Bettlach**
Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenzusammensetzung von laserbeschrifteten Implantatsstählen (D)
- 16.00 Uhr **Dr. Daniel Bindschedler, SGK, Zürich**
EC-Pen: ein Sensor für die industrielle Qualitätssicherung von Oberflächenbehandlungen(D)
- 16.30 Uhr **Abschluss des ersten Tages**

Programm / 30. Oktober 2008

Charakterisierung von metallischen Beschichtungen und Oberflächen

- 08.30 Uhr **Begrüssungskaffee / Anmeldung**
- 09.00 Uhr **Einführungsreferat: Dr. Uwe Beck, BAM, Berlin D**
Haftfestigkeit, Topographie und optische Konstanten – zentrale Kenngrößen modifizierter Oberflächen (D)
- 09.40 Uhr **Dr. Daniel Sutter, Helmut Fischer AG, Hünenberg**
Elektromagnetische Sonden – Chamäleons der Schichtdickenmessung (D)
- 10.10 Uhr **Apéro und Ausstellungsbesichtigung**
- 10.40 Uhr **Dr. Marcel Baak, Berner Fachhochschule – TI, Biel**
Oberfläche/Beschichtungsanalyse mittels Glimmentladungsspektroskopie (D)
- 11.10 Uhr **Rolf Bültemann, PowderCom GmbH, St. Gallen**
Messung von Schichtdicken mittels magnetischer Messprinzipien (D)
- 11.40 Uhr **Marlies Höland, Interstaatliche Hochschule für Technik, Buchs**
Röntgenographische Untersuchungen als Mittel zur Charakterisierung von metallischen und nichtmetallischen Beschichtungen (D)
- 12.00 Uhr **Dr. Joachim Göllner, Otto von Guericke Universität, Magdeburg D**
Optimierung und Beurteilung von Vorbehandlungen und Überzügen mit Hilfe elektrochemischen Rauschens (D)
- 12.30 Uhr **Mittagessen**
- 14.00 Uhr **Dr. Samuele Tosatti, SuSoS, Dübendorf**
Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung (un)behandelter metallischer Grenzflächen mittels XPS (D)
- 14.30 Uhr **Dr. Olivier Favrat, Institut FEMTO-ST, Besançon F**
Kontrolle der Oberflächenverunreinigungen vor dem Beschichtungsprozess (F)
- 15.00 Uhr **Dr. Peggy Rossbach, EMPA Dübendorf**
TOF-SIMS – ein vielseitiges Werkzeug in der Oberflächenanalytik (D)
- 15.30 Uhr **Dr. Roman Heuberger, RMS Foundation, Bettlach**
Oberflächenanalytik (REM, XPS) in der RMS Stiftung (D)
- 16.00 Uhr **Schlusswort**